デジタルファクトリー通信

2026年10月～2026年11月

東京エレクトロン デバイス株式会社

ハイライト

11月　トピックス

1	【画像処理マスターへの道】 WIL-Builder新機能　HDR・全焦点画像生成を気軽に試す
2	【導入事例4選】 半導体業界に必須！サイバー攻撃から考えるこれからの対策
3	【イベント情報】 SEMICON Japan 2025 出展のお知らせ

10月　トピックス

1	【画像処理マスターへの道】 相関エッジを目で見て調整　～可視化ツールのご紹介～
2	【特集記事】 一発検査！ 大型ワークの検査を変える 広範囲3D検査装置とは？

11-1

【画像処理マスターへの道】
WIL-Builder新機能　HDR･全焦点画像生成を気軽に試す

簡単に！

黒つぶれ･白飛び･ピンぼけ
まとめて解決！

全部くっきり！



※画像をクリックすると直接サイトに移動します

「こんな設定画面があればいいのに」から生まれた画像処理機能。
WIL-Builderに、黒つぶれ･白飛びを抑える「HDRプラグイン」と全面にピントを合わせる「全焦点画像生成プラグイン」の機能が登場。
もっと分かりやすく、もっと試しやすく。
設定による違いを直感的に確認できます。

▼詳細記事を見る
https://www.inrevium.com/pickup/wil-builder-plugin-hdr-and-allinfocus/

11-2

【導入事例4選】
半導体業界に必須！サイバー攻撃から考えるこれからの対策



※画像をクリックすると直接サイトに移動します

近年、サイバー攻撃が増加
半導体業界においてもセキュリティ対策は急務です
本インタビューでは、半導体業界の工場におけるリスクと対策をお話頂きました
攻撃を簡単に防御し更に信頼性をアップする運用と事例を紹介します

解決ポイント



EdgeIPS製品を導入
- ソフトのインストール不要
- ネットワーク工事なく低コスト

解決ポイント



Portable Inspecterを導入
- 装置出荷/導入 双方でチェック
- 持込みPCのチェック
- チェックレポートで信頼性アップ

▼詳細記事を見る
https://www.inrevium.com/pickup/txone/

▼導入事例集はこちら
https://survey.zohopublic.com/zs/lBClJU

【イベント情報】
SEMICON Japan 2025 出展のお知らせ

11-3

SEMICON Japan 2026

SEMICON® JAPAN

※画像をクリックすると直接サイトに移動します

東京エレクトロンデバイスは、2026年12月9日(水)～11日(金)に開催される
SEMICON Japan 2026に出展いたします。
半導体の「先端パッケージング」「ウェーハ製造」「フォトマスク」の各工程で使われる検査・計測装置を展示いたします。
皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

開催日時　:2026年12月9日 (水) ～ 11日 (金)
会場　　:東京ビッグサイト
参加費　　:無料（事前登録）
小間番号　:A1003

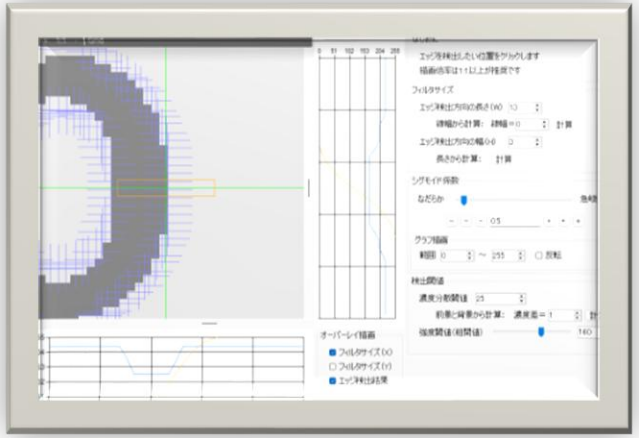


【画像処理マスターへの道】
相関エッジを目で見て調整　～可視化ツールのご紹介～

10-1

WIL-Builderで、パラメータ調整をもっと直感的に！

調整のポイント
相関エッジフィルタサイズ ／ シグモイド係数 ／ 強度・分散閾値



※画像をクリックすると直接サイトに移動します

01　見比べる

02　重ねて調整

▼詳細はこちら
https://www.inrevium.com/pickup/image-processing-correlation-edge-visualization-tool/

【特集記事】

一発検査！
大型ワークの検査を変える 広範囲3D検査装置とは？



※画像をクリックすると直接サイトに移動します

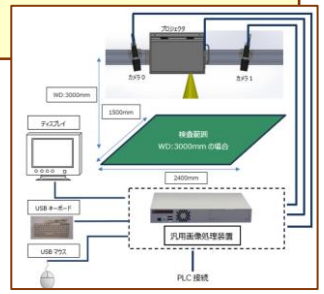
車のボディや建築材料などの大型製品の検査は、これまで多くの場合、人の目による目視検査に頼ってきました。

当社は、プロジェクタを用いたパターン投影技術を開発し、**一度の撮影**で**広範囲**の**三次元情報**を**取得**できるようにしました。

これにより、部品や塗装など、多数の検査対象を同時に効率よく検査することが可能です。

この**「広範囲3D検査装置」**は、すでに自動車メーカーの現場に導入されており、品質の向上や検査工数の削減に大きく貢献しています。

本記事では、広範囲3D検査装置の利点と特徴について詳しくご紹介します。



▼詳細はこちら

https://www.inrevium.com/pickup/3d-inspection_2/

DFS 事業（生産現場向け）　作業の自動化･効率化設備

半導体･パネル製造現場　/工場･ロジスティックス現場

ウェーハの外観検査

高速ウェーハ外観検査装置



パネル検査装置

外観欠陥検査･点灯検査



設備･プロセスの監視

設備診断･異常監視システム



人依存の作業自動化

工程作業　連動コントローラー



品質不良の要因調査

時系列データ自動分析マシン



計数作業のDX

パーツカウンター



Copyright © Tokyo Electron Device LTD. All Rights Reserved.

DFS 事業（装置開発者向け）

装置・システム組み込みソリューション

半導体製造装置 ・ 工作機械 / 加工機 ・ 各種検査装置など

画像処理ソフトウェア

画像処理ライブラリー(Windows/Linux)

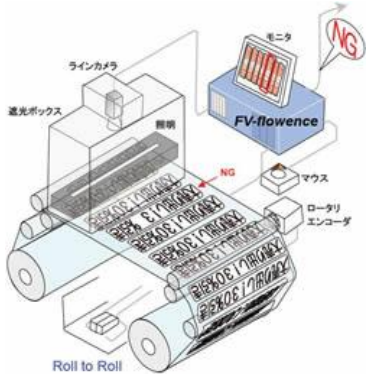
AIプラットフォーム



フィルム検査

検査アプリケーション

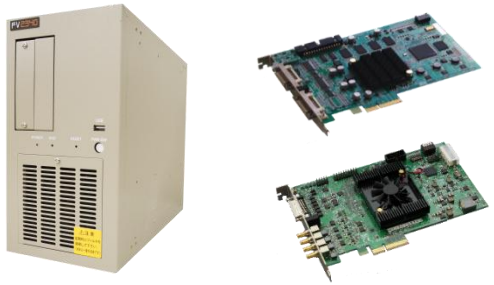
FV-flowence



画像処理ハードウェア

画像処理装置 / 画像入力ボード

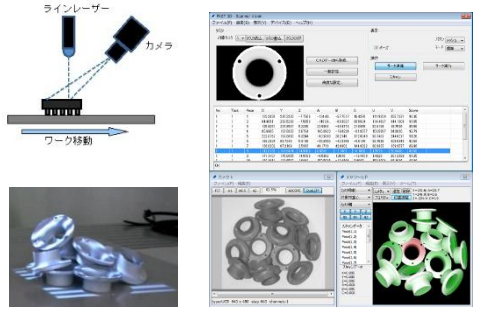
FVシリーズ



3次元計測・検査システム

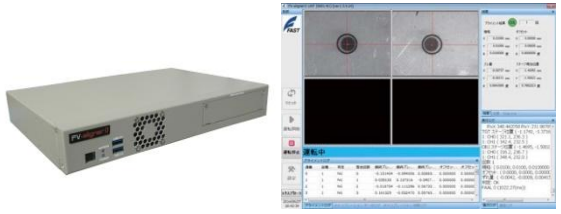
計測検査アプリケーション

FAST-3DPackage



位置決め装置

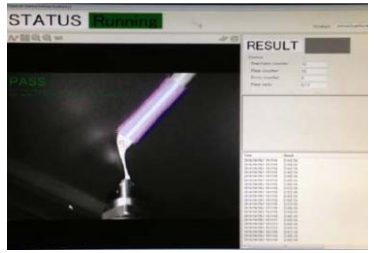
FV-alignerII



塗布検査システム

軌跡補正・検査アプリケーション

FV-Dispense Checker 2D/3D



Copyright © Tokyo Electron Device LTD. All Rights Reserved.

TED デジタルファクトリーソリューション 詳細一覧　詳しくはWEBで！https://www.inrevium.com/

生産現場

- **人依存の工程を自動化**

製品

- 自動面取り装置(ティーチングレス)
- 工程作業連動コントローラ　TriMath（トリマス）
- 材料袋のデパレタイズロボット
- 部品の個包装ロボット

ソリューション

- 洗濯機ピッキング・デパレタイズ
- 室外機 ピッキング・仕分け
- 鉱石 ピッキング・仕分け

- **予知保全・品質改善**

製品

- 異常検知・設備診断システム
- 時系列データ自動分析マシン
- CSVファイル 可視化・加工ツール（無料）
- 簡単IoTエッジデバイス ParaRecolectar

サービス

- モノづくりDX 計画作成講座
- 設備データドックサービス

ソリューション

- AEセンサによる設備異常の予兆監視

- **計測・検査**

フラットパネル検査装置

- フラットパネル検査装置 FV-pixellence

ウェーハ欠陥検査装置

- Si ウェーハ 欠陥検査装置
- SiCウェーハ 欠陥検査装置
- LT/LNウェーハ欠陥検査装置
- ガラスウェーハ 欠陥検査装置
- ウェーハ パターン 欠陥検査装置
- マスクブランクス 欠陥検査装置
- SiC 潜在欠陥拡張検査装置（UV-EVI：UV Expand Visualize Inspection)

計数・計測機器

- 手挿入基板検査装置
- 計数器・パーツカウンター
- 温湿度モニタリングシステム

TED デジタルファクトリーソリューション 詳細一覧　　詳しくはWEBで！https://www.inrevium.com/

装置メーカー

- **画像処理ライブラリ**

画像処理ライブラリ

- WIL（Windows向けライブラリ）
- FIE for Linux / FTL for Linux（Linux向けライブラリ）
- FAST Vision Library for LNX（LNX向けライブラリ）
- PyFIE（Pythonラッパーライブラリ）
- FV-AID / WIL-PDL（AI開発ツール、WIL推論ライブラリ）
- FIE for Raspberry Pi（ARM対応ライブラリ）
- FAST Vision ActiveX Components（Windows向けライブラリ）

- **画像処理装置**

画像処理装置

- FV 1410 （小型ボックスタイプ）
- FV 1420 （小型ボックスタイプ）
- FV 2340 （ミニタワータイプ）
- FV 2350 （ミニタワータイプ）

画像入力ボード

- CoaXPress画像入力ボード FVC10b
- Camera Link（Base）画像入力ボード FVC08CLB
- Camera Link（Base/Medium/Full）画像入力ボード FVC07
- 32点フォトカプラ絶縁I/Oボード FV-II320 / FV-II320-PNP

- **計測・検査・位置合わせ**

位置決め・アライメント

- 位置決め・アライメント FV-alignerⅡ

印刷検査システム

- 印刷検査システム FV-flowence

三次元計測システム

- 3D計測・検査システム(ロボットビジョン) FAST-3DPackage
- 3D計測・検査システム(光切断) FV-SurfaceFinder

塗布検査システム

- 塗布検査システム FV-DispenseChecker